

Curso Teórico-práctico Introductorio

“MICROSCOPIA DE BARRIDO POR SONDAS”

Auspiciado por el Sistema Nacional de Microscopías (SNM)

Coordinadoras: Dra. Patricia L. Schilardi y Dra. María Elena Vela (INIFTA, La Plata)

Lugar: Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), diag 113 esq 64, La Plata, Buenos Aires

Fecha de realización: 24 al 28 de septiembre de 2012

Duración: 45 hs teórico-prácticas.

Temario:

- Fundamentos de las microscopías de fuerzas atómicas (AFM) y de efecto túnel (STM)
- Fundamentos de técnicas derivadas de AFM: microscopía de fuerzas magnéticas (MFM), microscopía de fuerzas laterales (LFM), microscopía de fuerzas eléctricas (EFM), microscopía de fuerzas atómicas conductiva (C-AFM).
- Aplicaciones: análisis de superficies, sistemas biológicos, materia blanda, materiales nanoestructurados.

Profesores:

Dr. Roberto Salvarezza (INIFTA, UNLP-CONICET)

Dra. Lía Pietrasanta (CMA – UBA)

Dra. María Elena Vela (INIFTA, UNLP-CONICET)

Dra. Carolina Vericat (INIFTA, UNLP-CONICET)

Dr. Guillermo Benítez (INIFTA, UNLP-CONICET)

Dr. Omar Azzaroni (INIFTA, UNLP-CONICET)

Dra. Patricia Schilardi (INIFTA, UNLP-CONICET)

Requisitos para solicitar becas:

1. Ser graduado del área química, física, bioquímica, biotecnología, materiales o carreras afines.y estar cursando estudios de postgrado.
2. Enviar una carta de intención en donde se explica por qué este curso es de importancia para el desarrollo de su tarea de investigación, adjuntando un CV (hasta 3 páginas) a la dirección de correo electrónico microscopia_turnos@inifta.unlp.edu.ar

Fecha límite para la recepción de solicitudes de beca: 24 de agosto de 2012

Inscripción:

Secretaria de Posgrado, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP (www.exactas.unlp.edu.ar)

<http://163.10.19.42/se-po-c-in.php>

Información:

Dra. Patricia Schilardi (pls@inifta.unlp.edu.ar)

Dra. María Elena Vela (mevela@inifta.unlp.edu.ar)

con copia a microscopia_turnos@inifta.unlp.edu.ar